

國立交通大學

電子工程學系電子研究所

博士論文

鐵電薄膜電滯曲線之新型態量測方法與逐層結晶
之金屬/鐵電/絕緣/半導體結構之特性研究



New Methods for Measuring Hysteresis Loops of
Ferroelectric Thin Film and Characteristics of Layer-by-
Layer Crystallized Metal/Ferroelectric/Insulator/
Semiconductor (MFIS) structure

研究生：王丁勇

指導教授：張俊彥 博士

中華民國九十四年五月